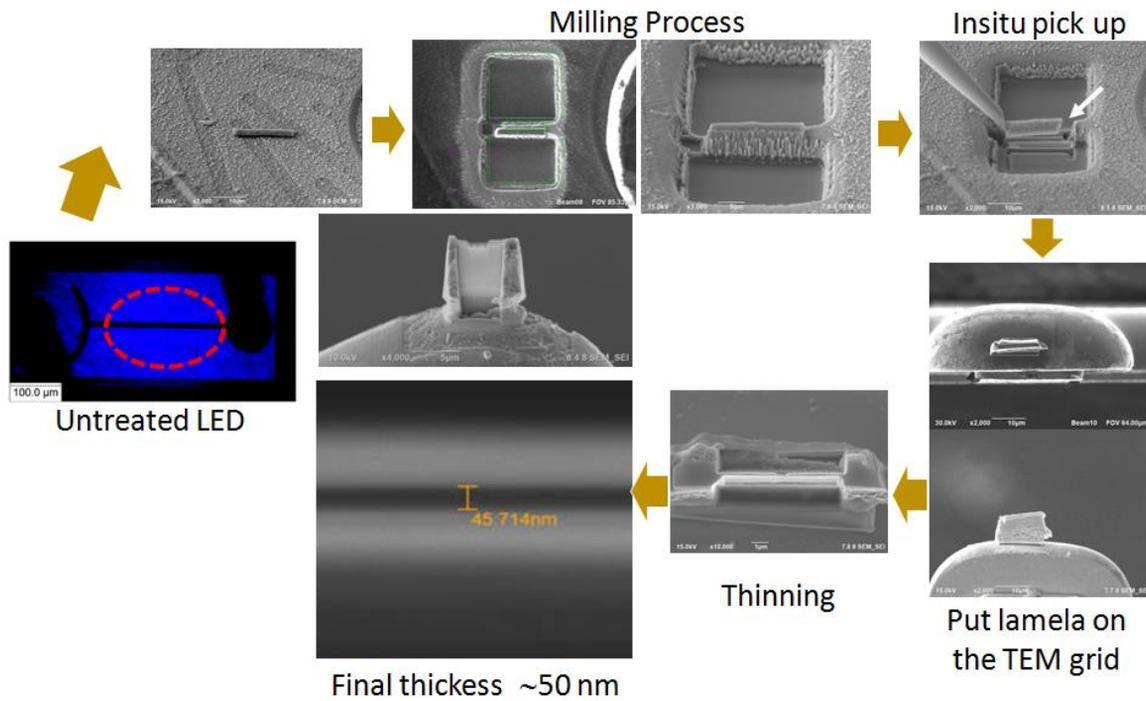


No. Handphone :

Unit yang akan digunakan JEOL JIB-4610F Multi Beam System

PREPARASI SAMPEL FIB

Gambaran Tahapan Proses Yang Dilaksanakan :



Persyaratan Umum :

1. Sampel harus berupa padatan
2. sampel geologis/logam/keramik
3. Sampel harus berbentuk flat dan sudah dipolis
4. Data dukung SEM yang telah dianalisis harus dilampirkan

Keterangan Sampel :

1. Jumlah sampel :
2. Nama dan komposisi/kandungan sampel

Nama Sampel	Komposisi/kandungan Sampel

3. Jenis bahan

- Logam/alloy
- Keramik
- Geologis



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI**

Laboratorium Imaging Fisika Maju

Gedung 440-442, KST BJ Habibie, Muncul, Setu, Tangerang Selatan 15310 Banten-Indonesia”
Phone: 0811-9811-562; Email labkarserpong@brin.go.id

FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

No. Dokumen : F-10

4. Bentuk dan dimensi sampel (Panjang x Lebar x Tebal)

- Kotak (maks. 15 x 10 x 3 mm) :
- Bulat (maks. Diameter 1 cm) :

5. Pendampingan Offline

- Ya
- Tidak (Sertakan referensi hasil sebagai acuan OA dalam melakukan pengujian)

* Pendampingan online ditiadakan

* Pendampingan offline maksimal 4 sampel

* Jika sampel lebih dari 4, sisa sampel akan di-*running* oleh operator (tanpa pendampingan)

6. **Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda,**

- Bersedia
- Tidak Bersedia

7. **Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian,**

- Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium Imaging Fisika Maju Gedung 442
- Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

Keterangan:

*tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif

*Sampel tidak boleh berupa cairan, basah, atau dimagnetisasi